図1

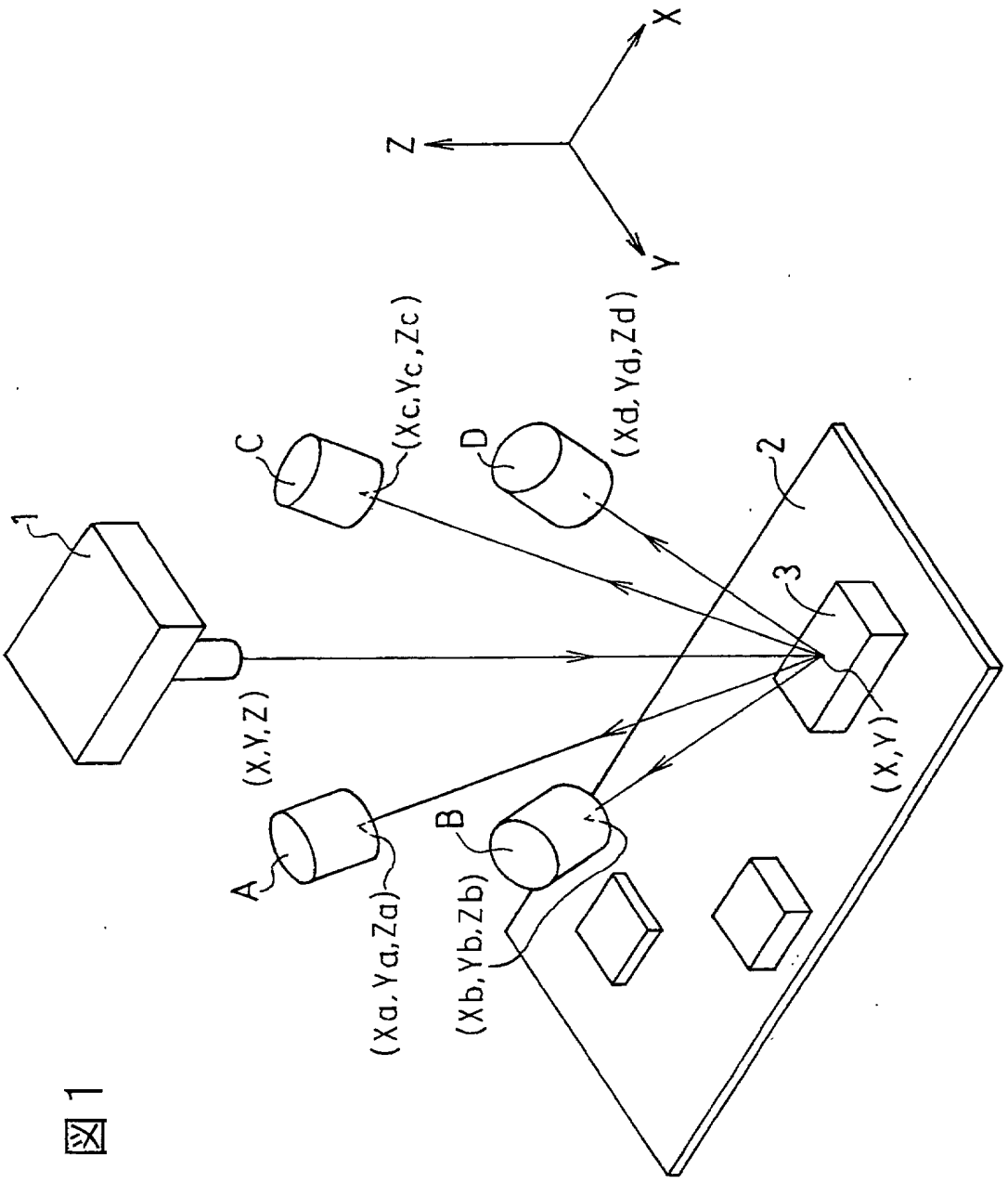
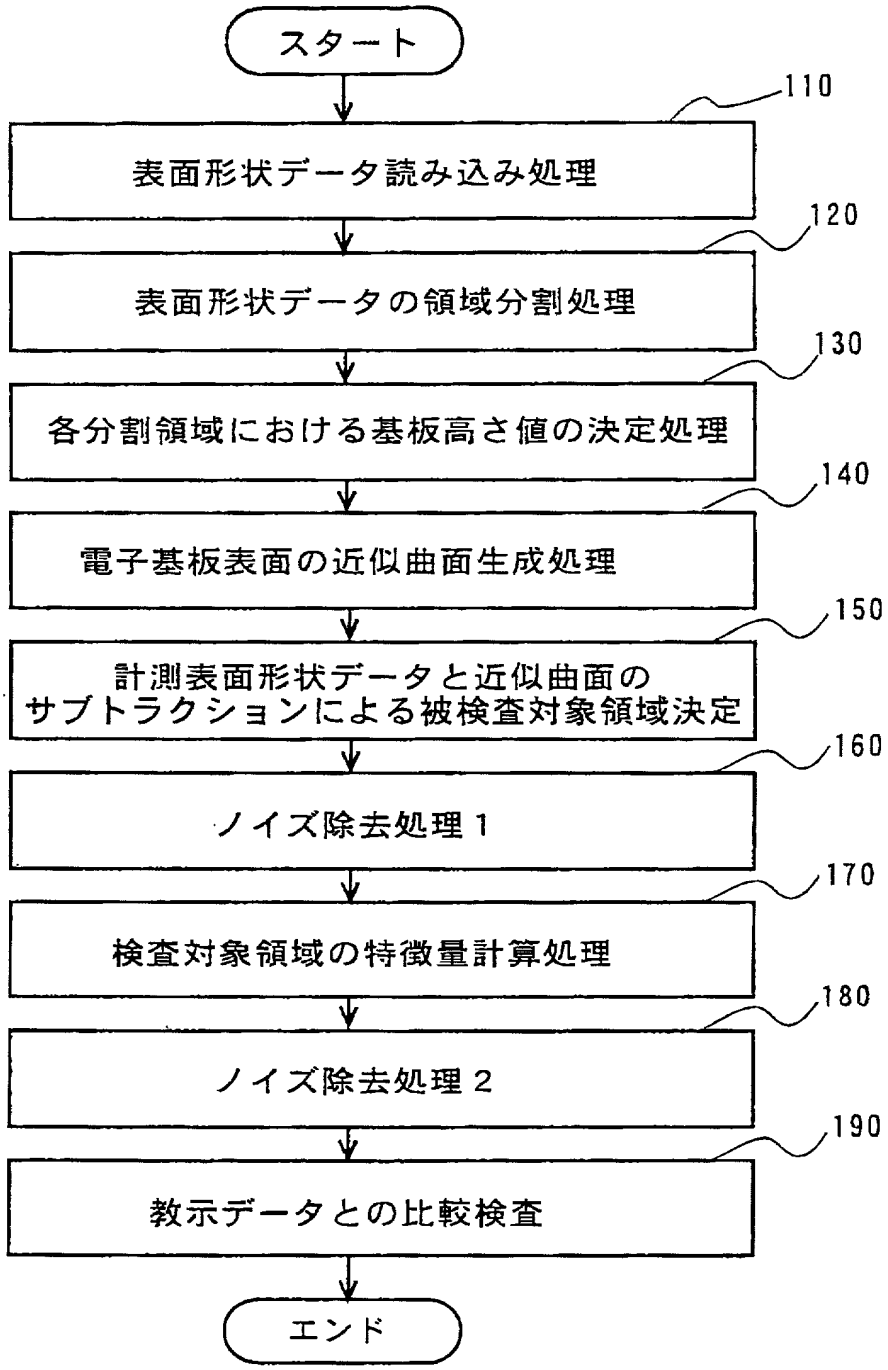


図２


スタート
110
表面形状データ読み込み処理
120
表面形状データの領域分割処理
130
各分割領域における基板高さ値の決定処理
140
電子基板表面の近似曲面生成処理
150
計測表面形状データと近似曲面の
サブトラクションによる被検査対象領域決定
160
ノイズ除去処理１
170
検査対象領域の特徴量計算処理
180
ノイズ除去処理２
190
教示データとの比較検査
エンド

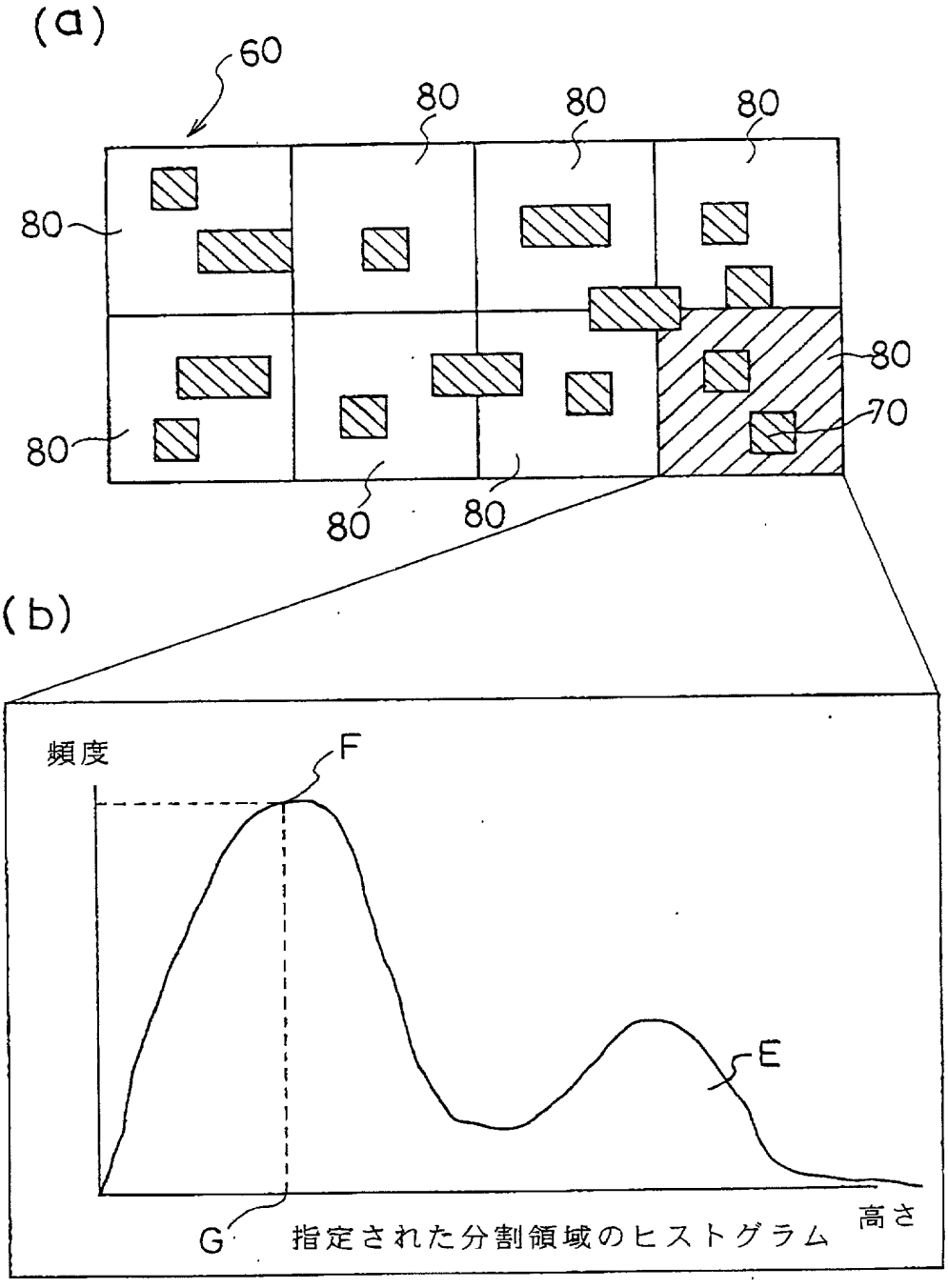



図3